

超顕微解析研究センター学内利用料金

2023年9月1日改定

	装置名	料金 (1枠=4時間あたり)
1	超高圧電子顕微鏡 JEM-1300NEF	15,000
2	新高分解能電子顕微鏡(※) JEM-ARM300F2	18,000
3	広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡 JEM-ARM200CF	15,000
4	収差補正走査／透過電子顕微鏡 JEM-ARM200F	14,000
5	ホログラフィー電子顕微鏡 HF-3300X	11,000
6	汎用電子顕微鏡 JEM-2100F	9,000
7	ハイコントラスト補助電子顕微鏡 JEM-2100HCKM	6,100
8	マイクロカロリメーター分析SEM ULTRA55+TES	7,700 (液体Heは実費)
9	デュアルビームFIB試料加工観察装置 Quanta 3D 200i	13,000
10	直交型FIB-SEM MI4000L	19,000 ※長時間の連続使用を ご希望の際はご相談ください
11	イオンビーム・電子ビーム複合型精密加工分析装置 Helios 5 UX Dual Beam	24,000 ※長時間の連続使用を ご希望の際はご相談ください
12	PIPS II Model 695 NanoMill Model 1040 イオンスライサ EM-09100 IS	1,100 /1枠あたり
13	イオンコーター JFC 1600 カーボンコーター EC 32010CC	500 /1回あたり

1枠は4時間 (10:00-14:00, 14:30-18:30, 19:00-23:00)

※九州大学研究環境整備事業に係る研究機器・設備利用料金規程による